高溫超導量子干涉元件用於非破壞性檢驗之探頭的設計與研製

邱文華、洪振義

E-mail: 9419921@mail.dyu.edu.tw

摘要

在工業界,目前都使用非破壞檢驗來發現產品內在或潛在的缺陷,使產品達到更安全可靠的程度。其中非破壞檢驗的種類包括有目視檢驗法、滲透檢驗法、超音波檢驗法及渦電流檢驗法…等幾項。 超導量子干涉元件(Superconducting QUantum Interference Device, SQUID) 是目前所知最敏感的磁通偵測器,使得超導量子干涉元件已被成功的使用在磁波及腦磁波掃描儀上,顯示生物的心磁或腦磁圖像,來做為醫學在心臟功能或腦功能臨床輔助診斷工具。另外,在材料的檢驗等方面,超導量子干涉元件已被研發來檢驗橋樑鋼骨結構、飛機起輪框等缺陷。 本文研究目的在設計與研製用於非破壞檢驗之探頭系統,並將高溫超導量子干涉元件使用於此系統上。探頭系統之設計需考慮真空夾層、系統溫度及高溫超導量子干涉元件擺設位置,方可達到探頭所需之最佳的量測環境。利用AutoCAD及Solid Works兩種電腦輔助繪圖軟體,繪製平面加工圖及3D立體圖。 材料則選擇玻璃纖維 (G-10),由於玻璃纖維的材料強度是依據其製造方式不同而有所差異,故探頭系統設計時必須考量玻璃纖維的製造方式,否則會因零件形狀及加工過程,造成材料本身的強度破壞,而無法達到探頭系統所需之真空壓力及系統溫度。 本文所研製之探頭系統經實際測試,已到達高溫超導量子干涉元件量測時所需的系統環境,可使用於現場非破壞量測上。

關鍵詞:非破壞檢驗,超導量子干涉元件,玻璃纖維,真空壓力

目錄

第一章 前言	1 第二章 文獻回顧	3 2.1 高溫超導量子干涉元件
量測原理3 2.1.1 約瑟芬	>結(Josephson Junction)3	2.1.2 直流約瑟芬效應(D.C. Josephson
Effect)4 2.1.3 超導量子干涉元件	├5 2.2 玻璃纖維(G	-10)的製造方式6 第
三章 高溫超導量子干涉元件非破壞性檢緊	_儉 探頭研製11 3.1 最初的探頭	系統結構設計12
3.1.1 探頭系統結構設計說明	12 3.1.1.1 內杜而瓶(Insider Dewa	r)12 3.1.1.2 外杜而
瓶(Outsider Dewar)14 3.1	.1.3 探頭系統(內、外度而瓶接合)	16 3.2 玻璃纖維(G-10)材料特
性17 3.3 温度計的		
性21 3.5 SQUID的	勺介紹23 3.6	6 修改部
份23 3.6.1	內杜而瓶233	3.6.2 外杜而瓶下方蓋
子26 第四章 結果與		
前27 4.2 探頭	系統修改後28	3 4.2.1 內度而瓶部
份28 4.2.2 外度而		深頭系統量測數據結
果31 第五章 結論	第33 參考	(文獻35
附錄	36	

參考文獻

- [1] 金重勳, 2002, 磁性技術手冊, 中華民國磁性技術協會。
- [2] 李玉芝、張裕恆, 1992, 超導物理, 儒林出版社。
- [3] 呂台華、洪姮娥, 1988, 超導體簡介, 中華民國中山學術文化基金會中山文庫。
- [4] 侯國深,1985,非破壞性檢測法,徐氏基金會。
- [5] 張志純,1986,纖維混成複合材料之應用,徐氏基金會。
- [6] 張志純著, 1969, 玻璃纖維及超級塑鋼大全, 徐氏基金會。
- [7] 鄭振宗, 2000, "直流高溫超導SQUID的特性及其在非破壞性檢測上之應用",臺灣師範大學物理研究所博士論文。